

請購規格確認表(Y/N Form)

一、詢價案號：07-QLA125

項次：0001			
材料編號：FKSEN15174			
品名規格：周邊研削機用AOI檢測器 備品編號:AIE-F2303			
請購規格確認表編號：AIEF2303			
請購規格確認表名稱：周邊研削機用AOI檢測器			
請購規格確認表內容：			
主項次 明細項次	規格名稱	品質標準	拒收標準
1	組成：工業電腦、周邊檢測模組(含鏡頭、光源)、電源供應器、分析軟體		
2	周邊缺陷		
1	需檢測出：100 um2 以上的缺陷		
2	檢測範圍：從導角邊緣往內5mm		
3	檢出率(AOI檢出缺陷數/實際缺陷數) > 99%，誤檢率(AOI檢出缺陷數/實際良品數) < 0.5%		
3	直徑量測		
1	檢量規格:重複精度：一倍標準差±3um		
4	訊號警示燈及蜂鳴器		
1	良品符合:綠燈		
2	不良品檢出：黃燈閃爍 + 蜂鳴器作動		
5	軟體要求		
1	需配合我司MES系統上傳量測數據		
2	需根據周邊面取加工的recipe，進行量測recipe切換		
6	需提供教育訓練。		
7	中文說明書。		
8	電腦連接到勝高公司內部網路前，需經勝高資訊組掃毒完成後才可進行網路連接。		
9	保固一年。		
10	面幅量測		
1	檢量規格：量測9個角度，以Notch為零度，每45度取一點計算)		
2	重複精度(um)：一倍標準差 (A1=10/A2=10/BC=10/B1=10/B2=10)		
3	重複精度(um)：一倍標準差 (R1=15/R2=15)		
4	重複精度(度)：一倍標準差 (Ang1=1/Ang2=1)		
11	Notch量測		
1	重複精度(um)：一倍標準差 (Vh=10/P1=10/P2=10/VW=15)		

2	重複精度(um)：一倍標準差 (VR=15/VR1=15/VR2=15/面幅=30)		
3	重複精度(度)：一倍標準差(AngV=1)		
12	檢測系統要求		
1	檢測系統(含軟硬體)兼容周邊研削機 WGM5200及WGM5200E，可對應 Windows和Dos系統		
2	檢測系統(含軟硬體)可對應300 mm&200 mm矽晶圓		
3	符合POC(Proof of concept)驗證結果		
4	不可影響周邊研削機之軟、硬體作動。		
13	業者報價前必須至現場確認後，方可進 行 報價。		
14	報價前需入廠實勘場地評估,得標後需二 次實勘,以免有所出入。		
15	保固條件	交貨後至少12個月	

[回前頁](#)